Accounts of Materials & Surface Research

New IUPAC recommendation and characterization of nanoporous materials with physical adsorption

Katsumi Kaneko*, Hayato Otsuka

Research Initiative for Supra-Materials, Shinshu University Wakasato 4-17-1, Nagano 380-8553, Japan kkaneko@shinshu-u.ac.jp

New IUPAC technical report on "Physisorption of gases, with special reference to the evaluation of surface area and pore size distribution" has been published (Pure Appl Chem. 87 (2015) 1051-1069). Important points of the IUPAC recommendation for characterization of porous materials with physical adsorption are, (1) classification of pores including "nanopores", (2) classification of types I and IV of adsorption isotherms into two subgroups, (3) classification of Type H2 hysteresis loops into H2(a) and H2(b) ones, (4) encouragement of application of Ar adsorption at 87 K for characterization of micropores, (5) encouraging of usage of GCMC simulation and DFT methods for pore size The supplementary description for better distribution. understanding of new IUPAC recommendation is given using physical adsorption data on nanoporous carbon materials.



Keyword: IUPAC recommendation, Physical adsorption, Pore structure, Gas adsorption, Surface area

Katsumi Kaneko is a distinguished professor of Research Initiative for Supra-Materials, Shinshu University. He had been a professor of physical chemistry, Graduate School of Science, Chiba University until March in 2010. He graduated the master program of Chemistry of the University of Tokyo in 1971. He published more than 510 papers on international journals. Chemical Society of Japan and American Carbon Society awarded him in 1999 and in 2007(Charles Petinos Award), respectively. He has developed *nanospace molecular science* using variety of insitu measuring systems for elucidation of molecular and ionic assembly structures in nanoscale pore spaces. He showed in-pore superhigh pressure effect of nanoscale



pores and partial dehydration effect for confined ions and he has contributed to quantum molecular sieving effect and water adsorption on hydrophobic carbons in addition to pioneering contribution to characterization of nanoscale carbon pores. After moving to Shinshu University, his study has shifted to *"in-pore nanomaterials science"*. He was in charge of president of International Adsorption Society from 2004 to 2007. He is a fellow of Royal Society of Chemistry, International Adsorption Society, and Chemical Society of Japan.

Hayato Otsuka is a researcher of Research Initiative for Supra-Materials at Shinshu University since this April. He earned his B. Sci. and M. Sci. in 2015 and 2017 from Shinshu University. His current research focuses on gas separation by using graphene oxide and zeolite.



新しい IUPAC 勧告と気体吸着によるナノ細孔体の細孔構造評価

金子克美*,大塚隼人 *信州大学先鋭材料研究所*

1. 物理吸着から求められる細孔構造の意義

ナノ細孔体は持続性社会の構築に必須のた めに幅広く研究されてきている。実際、1985 年 の物理吸着による細孔体のキャラクタリゼーショ ンに関する IUPAC の勧告以後に、規則構造性 シリカ、カーボンナノチューブあるいは MOF な ど新規のナノ細孔体が次々とナノ細孔体材料の 舞台に登場した。それに関連して気体吸着によ るナノ細孔構造の研究が活発に展開されてきた。 同時に、理論的な細孔構造評価法にも大きな 進展がみられた。そのようなことから気体の物理 吸着によるナノ細孔体の細孔構造の評価法を 改めて見直すこととなり、新 IUPAC 勧告が201 5年に公表されるに至った¹⁾。

ナノ細孔体には結晶本来の細孔構造を用い るゼオライトや MOF、固体構造は非晶質であり ながら規則的細孔配列構造を有する規則構造 性シリカ、あるいは活性炭のように細孔構造を含 めた固体構造全体が不規則的なものがある²⁾。 結晶性および規則構造性シリカの細孔構造決 定についてはX線回折法を適用できる。 ゼオラ イトや MOF では結晶構造が分かれば、理想的 な3次元の細孔構造を知ることができる。壁構造 が無定形の規則構造性シリカについてもX線回 折法によって細孔径を決めることができる。一方、 電気伝導性に優れているために、電気化学的 応用性が著しく高い活性炭では全く事情が異な っており、X線回折法を適用できない。活性炭な どのナノ細孔性カーボンのナノ細孔構造決定に は、気体の物理吸着法が重要な役割をもってい る。もっとも回折法ではなく、X線小角散乱法は ナノ細孔性カーボン中にある外界に繋がってお らず気体吸着法では評価できない細孔、あるい は気体吸着プローブ分子程度以下の極めて小 さい細孔の構造評価に役立つ 3。さて、回折法 と気体吸着法から得られる細孔径は必ずしも同 じではない。回折法から得られる細孔構造情報 は理想的な結晶格子に基づくものであり、かな

Acc. Mater. Surf. Res. 2020, Vol.5 (No.2), 25-32.

らずしも実効的な細孔構造を表しているとは言 えない。結晶の欠陥あるいは細孔中の不純物な どは、ナノ細孔空間の機能に影響を与えるので、 通常の回折法による解析だけでは、分子あるい はイオンの吸着や反応などにおける実効的な細 孔構造が理解できないことがある。そのために ゼオライトなどについても気体吸着法による実 効的な細孔構造評価が必要とされる。不規則細 孔体の代表的物質である活性炭にあっては気 体吸着法による細孔構造評価が不可欠である。 そのため本稿ではカーボン細孔体を例に挙げ ることとする。気体吸着法から得られる細孔構造 情報は実効的細孔径と細孔径分布、ならびに 細孔容積である。ここで実効的と強調しているの は、プローブ分子から見た細孔空間構造情報 であるということである。固体内の細孔構造は3 次元構造を有するが、気体吸着からの細孔径 は細孔の3次元パラメーターのうち最小の平均 値である。例えば活性炭はグラフェン様の構造 単位に由来して、スリット様細孔を持っているが、 スリットの奥行とスリット幅の情報ではなく、スリッ ト径が気体吸着法で決められる。例えばX線小 角散乱法での Guinier 解析から得られる慣性半 径は3次元構造パラメーターを含んでいるので、 スリット細孔径とは異なる。またX線小角散乱法 は分子がアクセスできない閉孔の情報を含んで いる。そのために気体吸着法、X線小角散乱法、 各種密度などを測定すると吸着気体がアクセス できる開孔だけでなく、閉孔も含めたポロシテイ が求められる^{3,4)}。また、活性炭中の細孔は互い に独立ではないので、X線小角散乱データを Guinier 近似で解析することは薦められていない 4)。透過電子顕微鏡による画像解析から求める 細孔径についても、試料が特別に配向していな い限り、気体吸着から得られるものとは異なる。 気体吸着からえられる実効的な細孔径 wは、細 孔に特別な配向がない限り、細孔壁(炭素グラ フェン様壁)と吸着プローブ分子との相互作用

によって決まる平衡位置間の距離である。この 細孔径で決まる細孔空間内には、その細孔径よ りわずかに小さな分子が充填される。分子シミュ レーションで用いる細孔径は物理的細孔径 (physical width: H で表すことが多い)という。分 子吸着が分子中心と細孔壁を形成する原子間 との相互作用に依存するので、物理的細孔径 は細孔壁を構成する原子層の核間距離で定義 される。そのため荒い近似としては物理的細孔 径 Hから炭素原子直径を差し引いたものが実効 細孔径 wである。ただし、これは 1 nm 程度の細 孔径の場合には、薦められない近似である。 窒 素分子が吸着プローブの時には、グラファイト基 底面の凹凸構造をも考慮した、 w = H - 0.24 nmを用いるのが良い⁵⁾。IUPAC 勧告にはこの大 事な点が触れられていない。

2. ミクロ細孔評価には 87 K でのアルゴン吸着 等温線測定が必要

細孔構造を決めるための気体吸着法では蒸 気吸着を用いる必要がある。化学的相互作用で はなく、分散相互作用によって蒸気の物理吸着 が進行するためである。広く使われる窒素吸着 では、蒸気状態において測定できるように沸点 の77Kを吸着温度としている。臨界温度以上の 気体(超臨界気体)を用いると、分子間相互作用 が熱エネルギーに対して小さく、細孔を十分に 充填するような吸着が起こらない。超臨界気体 を細孔中に十分に吸着させようとすると、高圧気 体吸着測定を行う必要があり、また高圧吸着等 温線の解析には独自の熱力学理論が求められ る 6。 超臨界気体は物理吸着には不向きである が、小さい細孔内部への拡散障害が小さいこと から、0.7 nm 以下の細孔評価などに用いられる ことがある。超臨界気体と蒸気吸着の違いは参 考文献を参照されたい ⁶⁾。さて、窒素分子が細 孔評価のプローブとして広く用いられる理由は、 不活性かつ小分子であることと77Kでの測定を するのに入手が容易な液体窒素を用いればよ いためである。極小分子のヘリウムを用いるとな ると、高価な液体ヘリウムの購入と極低温技術 が必要である。また、その温度では量子揺らぎ 効果が顕著になり、必ずしもヘリウム分子は小さ くない ^{7,8)}。窒素吸着は大変便利であるが、課題 がある。窒素分子は中性の2原子分子である。 しかし、平均的に見ると、分子内で電子分布に 基づく電荷の偏りがある。この偏りが4重極子モ ーメント(2ヶのプラス極と2ヶのマイナス極)を生 ずる。窒素分子の極めて近くに大きな電界がな い場合と極めて希薄な状態では、この四重極子 モーメントの効果を無視してよい。しかし、低温 で相対圧力が1に近づくと、窒素分子間距離が 小さくなり、四重極子モーメント間の相互作用で 安定化をえるような分子間配列をとる。炭素表 面、特に細孔の入り口にしばしばある酸性官能 基は10⁹ V/mという巨大な局所電場を有する⁹⁾。 このような局所電場は窒素の四重極子モーメン トに対して 77 K の熱エネルギーより数倍大きな 相互作用エネルギーを与える。四重極子モーメ ントと局所電場の相互作用が分散相互作用に 加わり、強い吸着を生ずることになる。このため に窒素分子サイズの2-3倍程度の大きさの細孔 入り口で、窒素分子は"どっしりと"吸着して、細 孔内部に動かない現象を引き起こす。エントラ ンスブロッキングという現象である。これが起こる と細孔の内部情報を得ることができない。ただし、 見かけの平衡吸着圧力を高くすると細孔入り口 に強く吸着している分子も細孔内部に移動を始 める。しかし、その細孔内拡散は極めて遅く、吸 着測定中に吸着平衡に達することができない。 そのために相対圧1付近に達してから、蒸気圧 力を低下させて脱着させると、脱着枝が吸着枝 の上に位置する吸着等温線がえられる。典型的 なキャピラリー凝縮では相対圧が 0.4 のところで 吸着窒素層が不安定化して脱着するので、吸 着ヒステリシスは 0.4 付近で閉じる。ところが、エ ントランスブロッキングで生ずる吸着ヒステリシス は、相対圧が 0.1 以下になっても閉じない。この 吸着ヒステリシスを低圧吸着ヒステリシスと呼ぶ。 これはエントランスブロッキングが起こっているこ との証拠である¹⁰⁾。このエントランスブロッキング を防ぐには4重極子モーメントを持たない、球形 の1原子分子がよい。また分子サイズが小さく汎 用性のある気体が望ましい。小さい分子でみる と、ヘリウムは上述のような課題があり、ネオンは 高いうえに量子効果も無視できない¹¹⁾。そこで



Figure 1. Adsorption isotherms of Ar at 87 K and N2 at 77 K on activated carbon fiber

空気分離から比較的安価に得られるアルゴンが 取り上げられる。アルゴンの沸点は87 K なので、 液体アルゴンを用いるか、低温装置によって87 K でのアルゴン吸着が行うことができる。最近で は100 K 以下での温度コントロールが容易かつ 比較的安価にできるようになった。このような事 情によって87 K でのアルゴン吸着が比較的手 軽な測定になりつつある。

新IUPAC勧告では小さいミクロ細孔の評価に は87Kでのアルゴン吸着が強く薦められている。 ナノ細孔性カーボンには窒素分子では評価で きないが、アルゴンで評価可能な細孔があること が多い。そのために、77Kでの窒素吸着と87K でのアルゴン吸着を対比すると、ナノ細孔性カ ーボンの特徴的な細孔構造が見えてくることが 多い¹²⁾。図1に平均細孔径が1.1 nmの活性炭 素繊維の窒素とアルゴンの吸着等温線を示す。 よく調べられている活性炭素繊維においてもア ルゴン吸着等温線と窒素吸着等温線に大きな 差異が見られる。相対圧が10-3以下では窒素吸 着量のほうが大きい。これは上述の窒素分子の 四重極モーメントの効果である。しかし、相対圧 が10-3を超えると、アルゴンの吸着量のほうが大 きくなる。これは窒素分子では低い相対圧で吸 着している吸着窒素が、さらなる窒素吸着を妨 げているためである。

3. 分子シミュレーションあるいは DFT 法の重 要性

新 IUPAC 勧告でも従来のように細孔径 wによる細孔分類法を踏襲している(表 1)。慣用的によく使われているウルトラミクロ細孔 (w< 0.7 nm)

とスーパーミクロ細孔 (0.7 nm < w < 2nm)につい ては従来どおりである。新しい点としてはナノ細 孔と言う呼称を認め、細孔径が w < 100 nm で ある細孔をナノ細孔としたことである。これは ASTM (American Society for Testing and Materials)のナノの定義に従っている。しかし、 ASTM では機械分野なども含む極めて広範囲 の標準化を行っているので、細孔構造において 100 nm 以下をナノ細孔と呼ぶことは必ずしも適 切ではない。細孔体への気体吸着の分野では 吸着機構の特殊性などからほぼ 5 nm 以下の細 孔をナノ細孔と呼ぶことが多い。このようにすると ミクロ細孔と小さなメソ細孔をナノ細孔と呼び、一 括して議論しやすいためである。ただし、これは IUPAC 勧告とは異なっていることに注意が肝要 である。

Table 1. Classification of pores

ミクロ細孔	w < 2 nm
メン細孔	2 nm < w < 50 nm
マクロ細孔	w > 50 nm
(ナノ細孔	w < 100 nm)

細孔径分布はどうかというと、半経験的な方法であるスリット細孔に対する Horvath-Kawazoe(HK)法と円筒型細孔に対する Saito-Foley(SF)法は細孔径を過小評価することが知られている¹³⁾。新 IUPAC ではグランドカノニカル モンテカルロシミュレーション(GCMC)法や Nonlocal 密度汎関数(NLDFT)法を用いることが望ま しいとされている。しかし、活性炭の場合には、 これらの理論解析法にしても元になる細孔構造 モデルに課題がある。多くのモデルでは無限に 広がった二枚のグラファイト壁に挟まれた理想

的なスリット細孔への吸着を仮定しているために、 活性炭の細孔評価を行うと、細孔径分布に必ず 約1 nm のところに節が表れる。これは無理にフ ィッテイングすることに由来する誤りである。最近 の NLDFT 法では、理想的なグラファイトに挟ま れたスリット空間ではなく、撓みのあるグラフェン に挟まれた空間を想定してモデルをもちいては いるが、課題が残る。新 IUPAC では均一なカー ボン細孔壁ではなく、カーボン細孔壁に不均一 構造性を考慮した Quenched solid DFT(QSDFT)法があることを紹介している¹⁴⁾。著 者の一人(金子)の研究経験から言えばQSDFT 法には、NLDFT 法からの細孔径分布の不合理 性がより少なく、多くのナノ細孔性カーボンの細 孔径分布を相当よく表していると言える。図2に はナノ細孔性グラフェンコロイドの窒素吸着等温 線から求めた細孔径分布を示す。QS-DFT 法と NL-DFT 法の場合も、解析条件や細孔モデル によっても細孔径分布が変わってくるので、これ だけで結論付ける訳にはいかない。ここでは、 市販装置についているソフトを使用した場合の 図2のような違いがみられることを示すに留めた い。カーボンの細孔構造の相対的な変化を検 討したい場合には、少なくとも同じ解析法を用い る必要がある。GCMC 法もいろいろな細孔径に ついての理論吸着等温線からなる kernal から出 発するので、理想的なスリット細孔モデルを用い ると、NLDFT 法による細孔径分布と同じ課題を 含んでいる。

表面積については BET(Brunauer-Emett-Teller)法が良く用いられる。ただし、ミクロ細孔 体の場合には上に述べた理由によって、<u>87 K</u> でのアルゴン吸着等温線を用いることが薦めら れている。この時アルゴンの分子断面積として



graphene colloids determined from QS-DFT(solid line) and NL-DFT(broken line) Adsorption isotherms of Ar at 87 K and N₂ at 77 K on activated carbon fiber

Acc. Mater. Surf. Res. 2020, Vol.5 (No.2), 25-32.

は 0.142 nm²を用いると良い。ただし、BET 法は ミクロ細孔性固体には正しく適用できないことが 多いので注意すべきであるという勧告である。 Ar 吸着を液体窒素温度で測定することは勧め られていない。Arの3重点が83.8 K であり、77 Kでのアルゴン状態を規定しづらいためである。 高分解能α。プロットの有効性にも多少ふれて いるが、BET 法がミクロ細孔性固体の表面積の 評価に適さない理由は新 IUPAC 勧告には明示 されていない。この理由はBET 表面積の算出が 単分子層容量の決定上の制限からきている。1 nm 程度のスリット状ミクロ細孔の場合には、二つ の壁との分子ー細孔壁相互作用が重なり合う。 そのため、平坦表面の場合よりも相互作用が極 めて強まり、低い相対圧で単分子層吸着が完了 する。それゆえ通常の相対圧領域(P/Pa=0.05-0.3) で BET 解析をすると、単分子層以上の吸着 量を単分子層容量として求めてしまうために、大 きい場合には 40%もの表面積の過大評価にな る。一方、小さなウルトラミクロ細孔では相互作 用ポテンシャルは一層強いが、両側のスリット細 孔壁に密な単分子層吸着が生成できないので、 BET 法を適用すると表面積を過小評価してしま う。単分子層吸着生成に対応する相対圧領域 で BET プロットすると相当正しい表面積を求め ることができる。新 IUPAC 勧告では、ミクロ細孔 の表面積を決めることは極めて困難としている が、上述の強いポテンシャル場による単分子層 容量の過大評価を除去する SPE 法(Subtracting Pore Effect Method)を用いると、0.7 nm 以上のミ クロ細孔の表面積は相当正しく決めることができ J¹⁵⁻¹⁷⁾

メソ細孔の評価はどうかというと、約 10 nm 以 上のメソ細孔は、長く使われてきた修正 Kelvin 式を用いる Barret, Joyner and Halenda (BJH)法 あるいは Broeckhoff /de Boer 法を適用してよい ^{18,19)}。しかし、これらの方法は約<u>10 nm 以下のメ</u> ソ細孔に適用すると、メソ細孔径を 20-30%も過 小評価してしまう。したがって、分子シミュレーシ ョンや DFT を適用することが望まれる。これらの ことは規則構造性メソ細孔シリカが登場した頃に ^{20,21)}、気体吸着の分野で盛んに議論された。 Kelvin 式に根差す理論によると両端が開いてい る円筒型メソ細孔では、窒素吸着等温線に明瞭 な吸着ヒステリシスが見られるはずである。ところ が、細孔径が 4 nm より小さいメソ細孔において は、毛管凝縮と同様な垂直な立ち上がりは認め られるが、吸着ヒステリシスがない。しかし、細孔 径が 4 nm 程度になるとヒステリシスループが現

れ、細孔径が大きくなるとヒステリシスが顕著に なる²²⁻²⁴⁾。典型的なメソ細孔では毛管凝縮現象 が吸着分子間相互作用に基づく表面張力でほ ぼ説明できるが、小さなメソ細孔においては分 子と細孔壁との相互作用も無視できない。その ために分子間相互作用に分子 - 細孔壁相互作 用を加えて取り扱う必要がある。このために 2-4 nm 程度の細孔径のメソ細孔は典型的な毛管凝 縮とは違う吸着機構を生ずる。分子シミュレーシ ョンや DFT では吸着分子間と分子 - 細孔間相 互作用を考慮しているので、ミクロ細孔に限らず、 メソ細孔についてもこれらの方法を適用すること が望まれている。

本勧告ではほとんど取り上げられていないが、 毛管凝縮に関して従来からの細孔閉塞効果だ けでなく、キャビテーションの存在が明らかにな ってきている。古くから例にあげられてきたのが メソ細孔の入り口が狭くなったインク壺型のメソ 細孔の場合である。もっとも最近の生活にはイン ク壺が使われていないので、将来的には他の呼 び方にかえたほうがよいであろう。このタイプのメ ソ細孔では、狭い細孔入り口に凝縮した安定な 吸着層に遮られて、大きな細孔部に凝縮した吸 着層はその細孔径に対応した圧力で脱着でき ない。つまり、細孔閉塞効果があるために吸着ヒ ステリシスを生ずる。しかし、Neimark 等²⁵⁾と Monson²⁶⁾によると、ネック部のサイズが約 5 nm 程度(77 Kの窒素の場合)以下であるときには、 細いネック部の凝縮液が安定ではなく揺動して いる。そのため、ケージ内に発生した泡(気相) がネック部を通って、気体分子が拡散・蒸発(脱 着)できるキャビテーション機構が起こることが明 らかになってきた。キャビテーションはネック部 が細く、そこの凝縮層は揺らぎが大きく内部凝 縮液との間の分子移動が容易であるために、脱 着等温線からネックサイズを知ることができない。 泡の発生開始圧力は凝縮液の特性によって決 まる。細孔閉塞効果によるのか、キャビテーショ ンによるのかを知るには、二種類のプローブ(窒 素とアルゴン)で吸着等温線を測るとよい。細孔 閉塞効果の場合とは異なり、キャビテーション機 構の場合には吸着気体の特性に脱着圧が依存 するので異なる細孔分布を与えるためである。

4. 吸着等温線と吸着ヒステリシスのタイプの多様化

新 IUPAC 勧告では図3 にみるように吸着等温線の分類がやや詳細になった。ミクロ細孔への

吸着等温線に対応するタイプ」と相互作用の強 いメソ細孔への吸着に対応する IV 型を(a,b)の 二つに分けたためである。IV 型については、前 の勧告では吸着ヒステリシスの存在を強調する あまりに、ヒステリシスのない場合を表していな かったので、(a,b)と分けることになった。一方、I 型については、ミクロ細孔径分布が狭く、細孔 径が 1 nm 程度以下のものと、細孔径がそれよ り大きめのミクロ細孔と約 2.5 nm 程度までのメソ 細孔を区別する必要性が考慮された。前回の 勧告以後、実に多種多様な細孔構造を持つナ ノ細孔体が開発されたためである。ゼオライトで はI(a)型が、カーボンではI(b)型が多い。IV(a)型 等温線もカーボン材料でよくみられる。V型は親 水処理していないナノ細孔性カーボンの水蒸気 吸着等温線でよくみられる。図4 でわかるように 吸着ヒステリシスでは、タイプH2が(a,b)に分けら れた。この事情も特に多様な細孔構造がある MOF/PCP の研究が活発になったことに関連し ている。



Figure 3. Classification of adsorption isotherm¹⁾



Figure 4. Classification of adsorption hysteresis loops¹⁾

5. 最後に

構造が無定形のために物理吸着による細孔 評価が極めて重要なカーボン材料を例にあげ、 基本的な細孔評価に関する解説を加えながら 新しい IUPAC 勧告のポイントを紹介した。しかし、 カーボン材料に限らず 1990 年以降に新たなナ ノ細孔体が次々に登場して、ナノ細孔構造研究 の重要性が高まった。この動きに対応して、高 分解能気体吸着等温線測定の導入、各種の構 造論的実験研究および分子シミュレーションと 密度汎関数法の適用がなされ、ナノ細孔への気 体の物理吸着機構が相当に理解できるようにな り、ナノ細孔構造の理解も進んだ。合成化学手 法が応用できる PCP/MOF 系のナノ細孔体は、 従来のナノ細孔体では考えられない活発な開 発状況にある。これらのナノ細孔体がいままで 以上に多様な吸着等温線を示すことも報告され、 従来の IUPAC 勧告を見直す必要性も生じた。 しかしながら、小さいミクロ細孔のキャラクタリゼ ーションが端的な例であるが、気体の物理吸着 による細孔構造評価はまだまだ十分ではない。 今後更に新たなアプローチが求められている。 本稿でも取り上げてきたナノ細孔性カーボンは 良好な電気伝導性を示す並びに化学的にロバ ストであることから、高表面積電極などとしてスー パーキャパシターなどのエネルギー貯蔵デバイ スとして大事な役割をもっている 27)。スーパーキ ャパシター特性のナノ細孔構造との関係の正確 な把握は大変重要であるが、形式的な BET 表 面積とキャパシター特性を比較したりする論文 が多く、有用な知見がえられていない。また、最 近の筆者のグループの研究によると、カーボン

Acc. Mater. Surf. Res. 2020, Vol.5 (No.2), 25-32.

のウルトラミクロ細孔中にあるイオンは、カーボン の壁に電荷の鏡像を生み、その鏡像電荷による 同種電荷間の斥力の著しい低減効果によって、 プラスあるいはマイナスイオン同士が集合でき、 見かけ上Coulombの法則に従わないようの構造 をとることもわかってきている²⁸⁾。この場合も細孔 径の決定が重要な意味をもっている。更に良く 電気を流す単層カーボンナノチューブは従来 のナノ細孔性カーボンとは全く異なる特性を示 すことがしられている。最近では燃料電池触媒 として白金ナノ粒子を単層カーボンナノチュー ブに担持すると極めて優れた耐久性を持つこと が明らかにされてきている。このようなナノ材料 の界面特性評価にも気体吸着による細孔構造 評価が大切である²⁹⁾。

6. 謝辞

図1と2は王書文博士が作成したものである。 本研究には科学研究(B)(No.17H03039)と JST OPERA(JPMJOP1722)の支援を得た。

参考文献

- M. Thommes, K. Kaneko, A. V. Neimark, J. P. Olivier, F. Rodriguez-Reinoso, J. Rouquerol and K. S.W. Sing, *Pure Appl. Chem.* 2015, *87*, 1051-1069.
- 2) K. Kaneko, J. Membr. Sci. 1994, 96, 59-89.
- M. Ruike, T. Kasu, N. Setoyama, T. Suzuki and K. Kaneko, *J. Phys. Chem.*, **1994**, *98*, 9594-9600.
- 4) S. Wang, D. Abraham, F. Fallejos-Burugos, K. Laszlo, E. Geissler, K. Takeuchi, M. Endo and

K. Kaneko, Langmuir, 2016, 32, 5617-5622.

- 5) K. Kaneko, R. Cracknell and F. Roger and D. Nicholson, *Langmuir*, **1994**, *10*, 4606-4609.
- F. Vallejos-Burgos, T. Ohba and K. Kaneko, in *Fundamental aspects of supercritical gas adsorption in Nanoporous Materials for Gas Storage*, ed. by K. Kaneko and F. Rodriguez-Reinoso, Springer, Singapore, 2019, pp. 41-64.
- H. Kuwabara, T. Suzuki and K. Kaneko, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1991, 87, 1915-1916.
- N. Setoyama and K. Kaneko, *Adsorption*, 1995, *1*, 1-6.
- F. Vallejos-Burgos, F.-X.Coudert and K. Kaneko, *Nat. Commun.* 2018, *9*, 1812-1821.
- A. D. Putri, N. Chotimah, S. K. Ujjain, S. Wang, R. Futamura, F. Vallejos-Burgos, F. Khoerunnisa, M. Morimoto, Z. Wang, Y. Hattori, T. Sakai and K. Kaneko, *Carbon*, **2018**, *139*, 512-521.
- H. Tanaka, M. El-Merraoui, T. Kodaira and K. Kaneko, *Chem. Phys. Lett.*, **2002**, *352*, 334-341.
- S. Wang, D. Minami and K. Kaneko, Microporous Mesoporous Mat. 2015, 209, 72-78.
- 13) C. Lastoskie, K. Gubbins and N. Quirke, J. *Phys. Chem.*, **1993**, *97*, 4786-4796.
- 14) A. V. Neimark, Y. Lin, P. I. Ravikovitch and M. Thommes, *Carbon*, 2009, 47, 1617-1628.
- 15) K. Kaneko, C. Ishii, M. Ruike and H. Kuwabara, *Carbon*, **1992**, *30*, 1075-1088.
- 16) N. Setoyama, T. Suzuki and K. Kaneko, *Carbon*, **1998**, *36*, 1459–1467.
- 17) T. Ohba and K. Kaneko, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 7171-7176.
- 18) F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. S. W. Sing, P. Llewellyn and G. Maurin, Adsorption by Powders and Porous Solids. Principles, Methodology and Applications, 2nd ed., Elsevier, Amsterdam, 2014.
- 19) S. Lowell, J. E. Shields, M. A. Thomas and M. Thommes, *Characterization of Porous Solids*

and Powders: Surface area, Pore size and Density, Springer, Dordrecht, 2004.

- 20) T. Yanagisawa, T. Shimizu, K. Kuroda and C. Kato, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **1990**, *63*, 988-992.
- 21) C. T. Kresge, M. E. Leonowicz, W. J. Roth, J. C. Vartuli and J. S. Beck, *Nature*, **1992**, *359*, 710-712.
- 22) P. Branton, K. Kaneko, N. Setoyama, K. S.W. Sing, S. Inagaki and Y. Fukushima, *Langmuir*, 1996, *12*, 599-600.
- 23) S. Inoue, Y. Hanzawa and K. Kaneko, *Langmuir*, **1998**, *14*, 3079-3081.
- 24) K. Morishige, M. Tateishi, F. Hirose and K. Aramaki, *Langmuir*, **2006**, *22*, 9220-9224.
- 25) C. J. Rasmussen, A. Vishnvakov, M. Thommes, B. M. Smarslv, F. Kleitz and A. V. Neimark, *Langmuir*, 2010, 26, 10147-10157.
- P. Monson, *Microporous Mesoporous Mat.*, 2012, 160, 47-66.
- 27) M. Salanne, B. Rotenberg, K. Naoi, K. Kaneko, P.-L. Taberna, C. P. Grey, B. Dunn, P. Simon, *Nat. Energy*, 2016, *1*, Article number: 16070.
- 28) R. Futamura, T. Iiyama, Y. Takasaki, Y. Gogotsi, M. J. Biggs, M. Salanne, J. Ségalini, P. Simon, K. Kaneko, *Nat. Mater.*, **2017**, *16*, 1225-1232.
- 29) R. Kukobat, X. Zhao, T. Kaneko, D. Stevic, Q. Wei, T. Hayashi, B. Daffos, P. Simon, B. Dunn, Y. Iwasawa, K. Kaneko, To be submitted.